

開催日: 2017年11月8日(水)
 受付開始: 9:30~ 4F コンベンションホール

後援: (国研)産業技術総合研究所

開会の挨拶	
10:00-10:05	早川 和己 日本NCSLI会長 / 日置電機(株)
講演	
10:05-10:35	講演[1] 電磁波の測定とそれに用いるアンテナの校正技術 Electromagnetic Wave Measurement and Antenna Calibration Technique 石居 正典 Masanori Ishii (国研)産業技術総合研究所 計量標準総合センター NMIJ, AIST 電子機器を製造・販売する際には、機器自身が発生する電磁波と外部からの電磁波の影響を評価するEMC試験が求められる。このような場合に用いられる、電磁波の測定技術と電磁波の測定に必要なアンテナの校正技術を紹介する。
10:35-11:05	講演[2] 音響パワーレベルの試験と不確かさ評価について~認定試験サービスの概要~ Testing of sound power level and estimation of uncertainty 花見 真一 Shinichi Hanami (一財)日本品質保証機構 JQA IT機器等においては静音性が重視されており、機器から放射される空気伝搬騒音を評価するため、音響パワーレベル及び放射音圧レベルの試験が行われている。試験結果の信頼性確保のために、近年ISO/IEC 17025に基づく認定試験所による認定試験サービスへの需要が高まっている。本講演では音響パワーレベル及び放射音圧レベルの試験概要、試験設備の評価結果及び測定の不確かさ評価結果を述べる。
11:05-11:30	休憩、「展示会」
11:30-12:00	講演[3] レーザ光源による放射照度および放射輝度校正設備の構築 Development of a calibration system for irradiance and radiance with laser light sources 竹迫 知博 Tomohiro Takesako 日置電機株式会社 Hioki E.E. Corporation 次世代ディスプレイの光源としてレーザーに対する期待が高まっている。日置電機では、産業技術総合研究所の協力の下、業界初のレーザー光源による放射照度および放射輝度校正設備を構築し、レーザーディスプレイ用光測定器の校正を実施している。本講演では、レーザー光源による校正の意義および実際の校正設備の概要について説明し、放射照度・放射輝度の校正設備構築におけるポイントについて議論する。
12:00-12:05	日本NCSLI 総会
12:05-13:35	休憩(昼食)、「展示会」
13:35-14:20	講演[4] 直流電流比較器、歴史とその応用 DC Current Comparator, History and Applications (同時通訳付き) リチャード・ティモンズ Richard Timmons ギルドライン社 Guildline Instruments Limited 本プレゼンテーションの目標は、直流比較器(DCC)の根本的な理論と、どの様に直流比較器を使用して非常に正確な直流抵抗値を測定するのかを理解して頂くことで、最初に直流比較器開発の歴史について手短かに説明する。直流比較器での直流抵抗値の測定は、現在でも室温での電気抵抗測定の最高の測定技術で、動作理論、主要な設計特性、不確かさを1ppmから0.015ppmに改良させた特許の技術について説明し、更に、DCC校正とレンジオ検証技術や直流比較器がどの様に抵抗測定値のトレーサビリティを提供するのかを説明し、標準抵抗とレンジオの選択技術、測定リードの使用、温度効果の削減、標準抵抗のドリフト情報の管理を含めた、測定不確かさを良くするための技術について考察する。
14:20-14:50	講演[5] マイクログラム分銅が展開するサブミリグラム領域へのソリューション Providing weighing solution of Microgram-weight for sub-milligram field 高柳 庸一郎 Yoichiro Takayanagi メトラー・トレード株式会社 METTLER TOLEDO K.K. 昨今、トレース可能なサブミリグラム領域(質量領域1mg未満)における計量計測標準基盤の構築がグローバルで展開されている。メトラー・トレードは産業界の要求から計量研究機関との連携により0.5 mg(500 μg)から0.05 mg(50 マイクロg)までの分銅の供給を開始した。供給に至る過程では反復使用への耐久性かつ簡便な取扱いに配慮した設計に対して様々な課題があった。本講演ではこのような背景をもとに再現性が確保された製品仕様、また信頼性が確保された校正及び校正証明書発行の現状について報告する。
14:50-15:20	休憩、「展示会」
15:20-15:50	講演[6] 近赤外放射温度計の面積効果測定と、定点黒体炉の実効開口径の推定について Measurement of size-of-source effect of near-infrared radiation thermometers, and estimation of effective source diameter of fixed-point black- 加藤 知則 Tomonori Kato 日本電気計器検定所 JEMIC 面積効果とは、見かけの放射源の面積により放射温度計出力が変化する現象で、精密な放射温度測定においては補正が必要である。弊所の近赤外放射温度計用の自動面積効果測定装置についてその概要を紹介する。面積効果補正は定点黒体炉の校正の際にも必要であるが、内部絞りの明るさも考慮に入れた実効開口径で補正するべきである。数値計算による定点黒体炉の実効開口径の推定を試みたので、その概要を紹介する。
15:50-16:20	講演[7] 湿度標準の供給体制と相対湿度測定の注意点 Humidity standard system in Azbil and knowledges for relative humidity measurement 中垣内 直美 Naomi Nakagaichi アズビル株式会社 Azbil Corporation 当社は分流式湿度発生装置と露点計を組み合わせることで湿度標準の供給を行っている。これらの設備や供給体制についての紹介と相対湿度を測定する際の注意点などについて紹介する。
16:20-17:05	講演[8] ISO/IEC 17025 改正の動向について Revision progress of ISO/IEC 17025 大高 広明 Hiroaki Ohtaka (独)製品評価技術基盤機構 NITE 試験所・校正機関のマネジメントシステムの根拠として広く活用されている国際規格であるISO/IEC 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)の改正作業が進行中である。その改正の動向について、ISO/CASCO(適合性評価委員会)の改正ワーキンググループ(WG44)における活動内容、及び主な改正の内容について報告する。
17:15-18:45	懇親会 会場: 4Fコンベンションホール

※講演プログラムは事前の予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。